

电子零部件高低温试验材料温度老化试验

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 电子零部件高低温试验材料温度老化试验 |
| 公司名称 | 深圳市泰斯汀检测认证技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路锦湖大厦C栋203室-R02 |
| 联系电话 | 17796307686 17796307686 |

产品详情

高低温试验

高低温冲击试验介绍本试验是用来确定产品在高温低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时

间。

试验目的:提供一个标准的试验程序，用来确定温度渐变的非散热电子电工产品或经受温度突变而无有害影响的散热电子电工产品(包括元件、设备

及其他产品)在高低温条件下使用与存储的适应性。

参考试验标准IEC?60068-2-2，GB/T?2423.2，GJB?150.3，MIL-STD-810F，GJB?360.8，MIL-STD-202F，EIA?364，GB/T?2423.1，IEC?

60068-2-1，EIA?364，MIL-STD-810F，GJB?150.4，GB/T?10592等。

高低温试验国家标准GB/T?2423.2，GB/T?2423.1

测试流程工程师对试验样品进行外观检查，对其电气和机械性能进行检查;将不通电的试验样品，按正常工作位置或状态放入试验箱内;当实际试验

样品是和某种特定的安装架(夹具)一起使用时，试验时就应使用这些装置一起进行试验。如需测试时通电进行，则将按有关标准规定对试验样品给

予通电或电气负载，使产品处理运行状态，将设备按不大于1 /min的温度变化速率调到试验规定的高温或低温温度并在此温度下保持规定的时间，

试验持续时间应从温度达到稳定的时算起;条件试验结束后，试验样品将进入恢复程序，如果在条件试验期间试验样品是处理运行或负载状态的，进

入恢复程序之前，应将其断开电源或卸去负载，且样品应放在标准大气条件下保持足够时间使其温度稳定，少1小时;根据相关标准或客户要求

在试验样品可在恢复期间进行加电检查功能或机械性能检查。